

Single Diode

Schottky Barrier Diode

D1FJ4

40V 2A

特長

- 小型SMD
- Tj=150°C
- 低Ir=0.2mA
- 熱暴走を起こしにくい

Feature

- Small SMD
- Tj=150°C
- Low Ir=0.2mA
- Resistance for thermal run-away

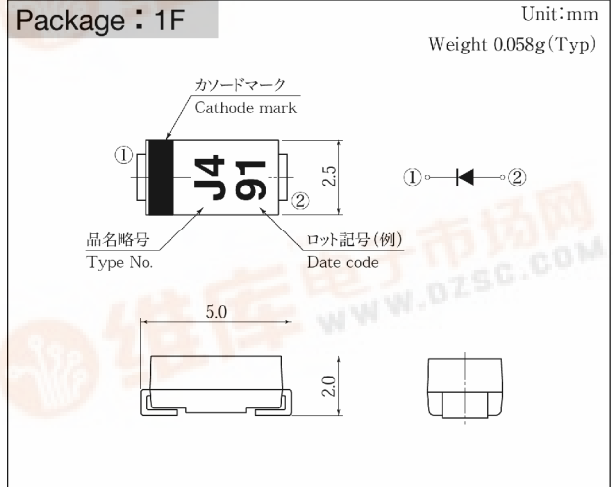
用途

- スイッチング電源
- DC/DC コンバータ
- 家電、ゲーム、OA 機器
- 通信、ポータブル機器

Main Use

- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Game, Office Automation
- Communication, Portable set

■ 外觀図 OUTLINE



外形図については新電元Webサイト又は〈ダイオードカタログ・技術資料編〉を参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of the outline dimensions, refer to our web site or the diode technical data book. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■ 定格表 RATINGS

● 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 Tl = 25°C)

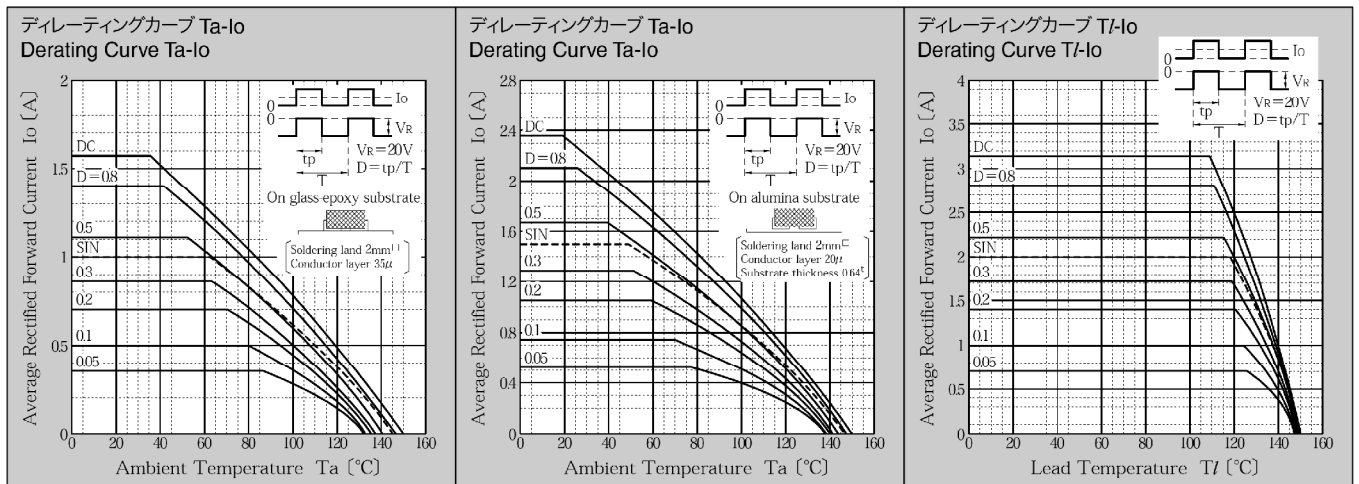
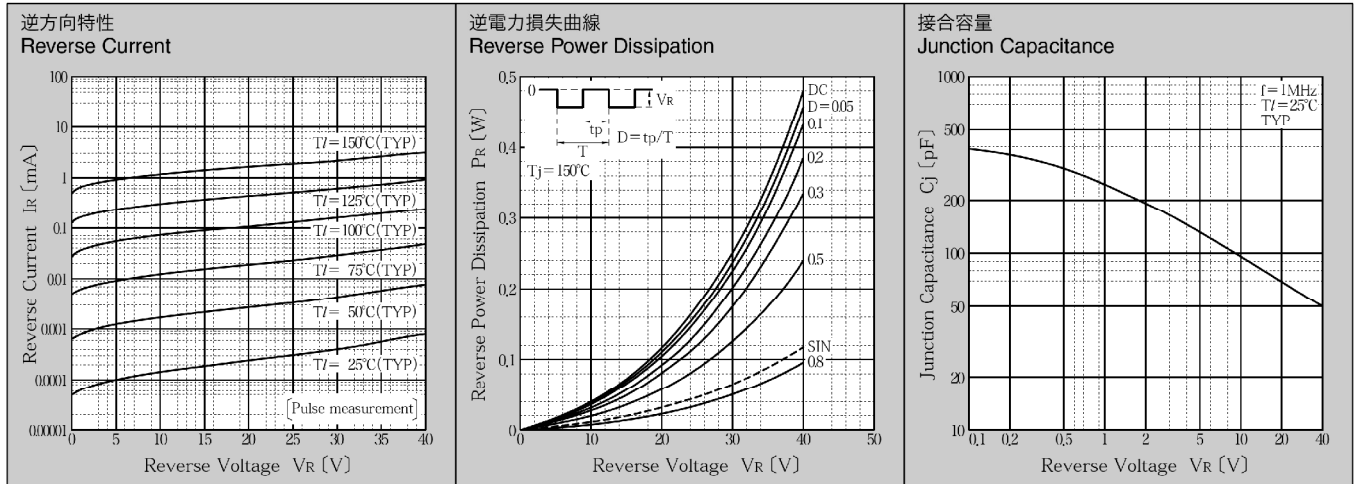
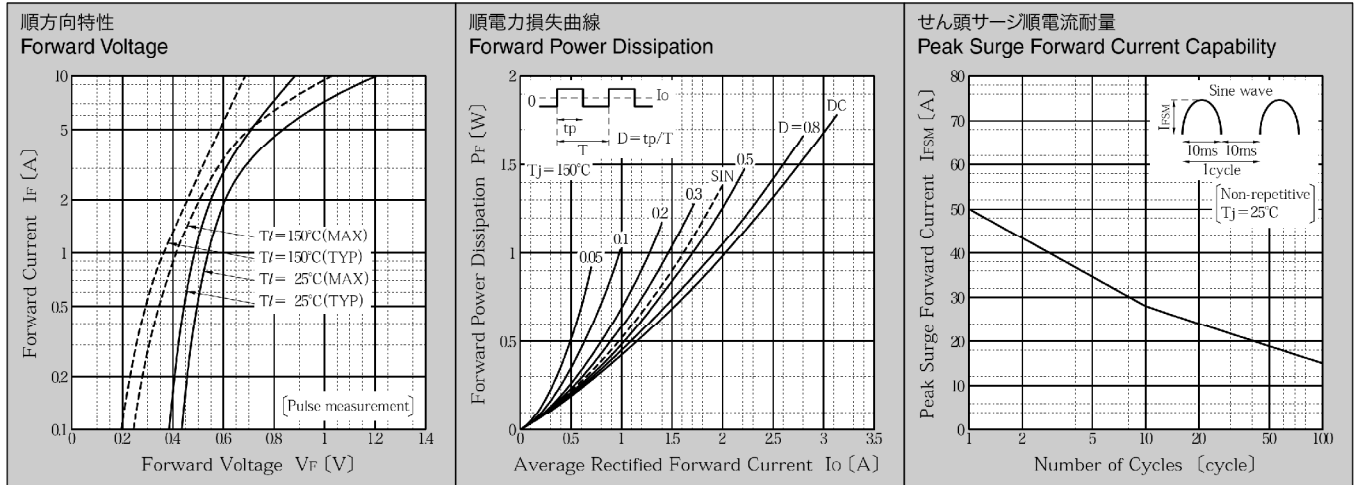
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D1FJ4	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			40	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	Ta = 62°C プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	1.0	A
			Ta = 48°C アルミナ基板実装 On alumina substrate	1.5	
			Tl = 117°C	2.0	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, Tj = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj = 25°C		50	A

● 電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 Tl = 25°C)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 1.5A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.57	V
		I _F = 2.0A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.61	
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = V _{RM} , パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.2	mA
接合容量 Junction Capacitance	C _j	f = 1MHz, V _R = 10V	TYP 96	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jl}	接合部・リード間 Junction to lead	MAX 23	°C/W
		接合部・周囲間 Junction to ambient	アルミナ基板実装 On alumina substrate	
	プリント基板実装 On glass-epoxy substrate		MAX 157	



■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.
* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
Typical is a statistical average of the device's ability.
* Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.